

## 第 5 回 探針を利用した表面分析法 (STM,AFM)

2015 年 1 月 21 日 (水)

### 講演概要

30 年程前に発明された走査プローブ顕微鏡 (Scanning Probe Microscopy:SPM) は、原子を直接見ることの出来る、原子を操作することの出来る顕微鏡として、現在では標準的な研究手法となっている。しかし、多くの研究現場では原子を見る顕微鏡としてよりも、表面の凹凸あるいは粗さを高分解能で測定する装置として用いられていることが実態であろう。SPM は当初素朴に考えられたよりも複雑であるとともに、豊かな可能性を持った手法であることが明らかになってきている。

本講演ではなるべく平易に SPM の原理・基礎を理解することを目的とする。また発展的課題として SPM の可能性、表面の形状測定としての SPM の位置づけについても考えてみたい。